

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

— 日立半導体技術情報 —

〒 1 0 0 - 0 0 0 4
 東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 2 号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5134 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	マイクロプロセッサ		発行番号	TN-SH7-450A	Rev.	第 1 版
題名	SH7705 バウンダリスキャンに関する注意事項		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	HD6417705	対象ロット等	関連資料	SH7705 ハードウェアマニュアル 第 1 版 ADJ-602-305		有効期限
		全ロット				永年

SH7705 バウンダリスキャンに関して下記の注意事項がありますので、ご理解、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

【内容】

バウンダリスキャンテストを行う場合、常時 CKIO クロックが動作している状態にしてください。
 MD[2:0]端子は、使用するクロックモードに設定し、EXTAL および CKIO は CPG の章で規定された周波数範囲に設定してください。

- モード 7 時：電源投入後、安定した CKIO クロックを供給した後、バウンダリスキャンテストを行ってください。
- モード 7 以外時：電源投入後、CKIO クロックが安定するまで待ってからバウンダリスキャンテストを行ってください。